

2022 年新春電子顕微鏡解析技術フォーラムのお知らせ

公益社団法人 日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会
責任者 丸山 秀夫
実行委員長 工藤 修一

日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会では、機能性材料や電子デバイスの評価に関する身近な疑問点をざっくばらんに話し合う場として「電子顕微鏡解析技術フォーラム」を開催しております。

今年度は昨年度と同様、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、オンラインで開催します。

今回は夏のフォローアップとして、「**試料ができなきゃ、その先はない！電池材料評価と電解研磨の秘訣を教えます**」と題し、試料作製について、具体的な材料への適用事例を中心に、更に議論を掘り下げます。

トピックスでは、試料作製の中でも、特に取り扱いが難しい電池材料を取り上げ、大気非暴露条件下における試料調製と実際の観察・解析事例についてのご講演を頂きます。

この他にも、前回好評を博した金属材料の代表的な試料作製法である電解研磨と FIB を再度取り上げ、両者の像質の違いや目的に応じた使い分け等について、更に実践的な解説を頂きます。

また、今回はこのフォーラムの特色である「ざっくばらんトーク」の時間を拡大し、皆様の日頃抱えている疑問点や困り事を持ち寄って頂き、今後の電子顕微鏡解析業務に役立つ議論をいたします。

電子顕微鏡に携わる皆様、ふるってご参加ください！

記

1. 主 催：公益社団法人 日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会
2. 日 時：2022 年 1 月 21 日（金）13:15 ～ 16:30（予定）
開催形式：オンライン開催（web 会議システム Teams）
参加費： 無料
3. 定 員：150 名
4. 申し込み期間：12 月 16 日～12 月 24 日（定員になり次第締め切ります）。
申し込み方法：12 月 16 日に電子顕微鏡解析技術フォーラム HP 上にてお申込みフォームの URL を公開いたします。サイトにアクセスして頂き、必要事項をご記入の上、お申込みください。

問い合わせ先：

日鉄テクノロジー（株） 水尾 有里 e-mail: mizuo.yuri.8dg@nstec.nipponsteel.com
電 話： 0439-80-2866 ファクシミリ：0439-80-2733
HP：<http://www.em-forum.sakura.ne.jp/>

5. 主な内容

- ・電子顕微鏡観察のための大気非暴露による試料調整と観察例 小林 俊介 (JFCC)
 - ・全固体リチウムイオン電池の in situ SEM 観察技術 加藤 健太郎 (東レリサーチセンター)
 - ・「電解研磨法 夏のフォローアップ ～FIB との比較～」 宮澤 知孝 (東京工業大学)
 - ・画像処理ワーキンググループ活動の中間報告(仮) 乾 光隆 (セイコーエプソン)
 - ・ざっくばらんトーク
- 皆様から頂いた質問から、数件をピックアップし、参加者間で議論します。

<電子顕微鏡解析技術フォーラム実行委員>

丸山 秀夫 (ナカテック)、石丸 雅大 (サーモイッシャーサイエンティフィック)、乾 光隆 (セイコーエプソン)、遠藤 徳明 (日本電子)、木村 耕輔 (東レリサーチセンター)、工藤 修一 (ナカテック)、志摩 会実佳 (東芝アナリティクス)、白井 学 (日立ハイテクノロジーズ)、高橋 知里 (産総研)、長澤 忠広 (ライカマイクロシステムズ)、水尾 有里 (日鉄テクノロジー)、宮澤 知孝 (東京工業大学)、武藤 俊介 (名古屋大学)、村上 和歌子 (リコー)、吉田 誠 (旭化成)、和田 充弘 (三井金属)